4-49

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ УССР

КИЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им.А.М.ГОРЪКОГО

В.П.ЧЕРНЯВСКИЙ

На правах рукописи

ПОЛУЧЕНИЕ И КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ Сціпте₂ И СПЛАВОВ РАЗРЕЗА Сціпте₂- Сате

/01.049 - физика полупроводников и диэлектриков/

Диссертация написана на русском языке

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Киев - 1972



Работа выполнена в Киевском государственном педагогическом институте им.А.М.Горького и Ленинградском ордена Ленина физихо-техническом институте им. А.Ф.Иоффе АН СССР.

Научные руководители:

доктор химических наук, профессор [Н.А.ГОРЮНОВА], кандидат физико-математических наук, доцент И.И.ТЫЧИНА.

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор В.Н.РОМАНЕНКО, кандидат физико-математических наук, доцент И.В.ПОТЫКЕВИЧ.

Ведущее предприятие - Ордене трудового Красного Знамени институт проблем материаловедения АН УССР.

Автореферат разослан "27"_ Шау 1972 r. 10 Защита диссертации состоится " в " опребре 1972 г. на заседании Ученого совета физико-математического факуль тета Киевского государственного педагогического института им. А.М.Горького /252650. Киев-30. ул. Пирогова, 9/.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института.

ученый секретарь совета Э. ти /и.и. тычина/

Изучение многокомпонентных полупрозодниковых материалов является одной из актуальных задач физики полупроводников и имеет важное значение не только для развития науки о твердом теле, но и для расширения круга материалов, используемых в полупроводниковой технике.

Свыше двух десятилетий широко исследуются алмазоподобные бинарные соединения типа А^ЗВ⁵ и А²В⁶ и твердые растворы на их основе. Многие из этих материалов уже нашли практическое применение.

В последние годы проводятся исследования тройных алмазоподобных соединений со структурой халькопирита – ближайших изоэлектронных аналогов соединений A^3B^5 и A^2B^6 . Установлено, что соединения типа $A^2B^4C_2^5$ обладают целым рядом особенно – стей, обусловленных усложнением состава и кристаллической решетки, по сравнению с их изоэлектронными аналогами A^3B^5 . Эти особенности позволяют расширить область применения алмазоподобных полупроводников.

Изучение тройных халькогенидов типа $A^{I}B^{3}C_{2}^{6}$ — изоэлектровных аналогов соединений типа $A^{2}B^{6}$ — находится еще в начальной стадии в связи с трудностью их получения в гомогенном состоянии. Кристаллохимическая аналогия соединений $A^{I}B^{3}C_{2}^{6}$ и $A^{2}B^{6}$ позволяет с уверенностью рассчитывать на наличие в свойствах соединений типа $A^{I}B^{3}C_{2}^{6}$ особенностей, обусловленных замещением "катионов" соединений $A^{2}B^{6}$ двумя сортами элементов атомов первой и третьей групп Периодической системы элементов. Получение твердых растворов между соединениями типа $A^{1}B^{3}C_{2}^{6}$ и бинарными соединениями типа $A^{2}B^{6}$, обладающими рядом ценных для практического применения свойств, открывает пер – спективы получения новых разнообразных по своим свойствам полупроводниковых материалов.

Наиболее актуальными задачами при исследовании соединений типа A^IB^SC⁶₂ следует считать изучение диаграмм состояния систем A^I - B^S - C⁶ и сплавов на основе этих соединений с соответствующими бинарными аналогами, разработку методов получе ния монокристаллических образцов соединений и твердых растворов, исследование их физико-химических и физических свойств.

Такое комплексное изучение соединений типа A^IB²C₂⁶ и сплавов на их основе позволит наметить пути получения новых полупроводниковых материалов и оценить возможность их применения в технике.

Настоящая работа посвящена получению и комплексному исследованию соединения CulnTe₂ - изоэлектронного аналога CdTe и твердых растворов разреза CulnTe₂-CdTe . Второй компонент разреза - теллуристый кадмий хорошо изучен, обладает интересным сочетанием свойств и широко применяется в полупроводниковой технике. Изучение CulnTe₂ и сплавов указанного разреза проведено с целью выявления характера изменения физических свойств при изменении состава и кристаллической структури, а также для вняснения возможностей их практического применения.

Данная работа является частью исследований в области многокомпанентных полупроводников, проводимых совместно лабораторией физико-химических совйств полупроводников ордена Ленина ФТИ им. А.Ф. Иоффе АН СССР и отраслевой лабораторией физики

- 4 -

полупроводников Киевского педагогического института им. А.М. Горького. Диссертация состоит из введения, четырех глав и общих выводов.

В первой главе приводятся и анализируются литературные данные о методах получения, физических и физико – химических свойствах тройных жалькогенидов типа A^IB³C⁶₂ и твердых растворов на их основе, изложены вопросы, связанные с механизмом образования и кристаллохимическими особенностями соединений A^IB³C⁶₂, рассмотрены закономерности изменения свойств при изменении химического состава соединений.

На основе анализа данных, приведенных в обзоре литературы, делается вывод о том, что тройные фазы AIB3C6 можно рассматривать, как соединения, образующиеся в твердом состояния при фазовом переходе І-го рода к упорядочению "катионов" в 5 - фазах бертоллидного типа. В соединениях типа A^IB³C₂ по мере увеличения атомной массы второго "катиона" происходит закономерное увеличение параметров кристаллической решетки, уменьшение ширины запрещенной зоны, снижение температуры плавления и уменьшение микротвердости. Такие же изменения пара метров происходят при замене атомов мали атомами серебра. Подобная корреляция свойств при изменении средней атомной массы атомов является характерной для бинарных алмазоподобных сое динений типа А³B⁵ и А²B⁶. При переходе S-Se-Te в соединениях типа А^I B³C⁶ с одинаковыми "катионами" так же, как и в соединениях типа А2В6, наблюдается уменьшение ширины запрещенной зоны. Связанное с уменьшением монной компоненты химической связи. По физико-химическим и физическим свойствам соединения AIB3C2 занимают промежуточное место между соединениями А³B⁵

и A^2B^6 в изоэлектронных рядах алмазоподобных соединений. В пользу этого свидетельствует возможность образования твердых растворов в широких интервалах концентраций как с соединениями типа A^2B^6 , так и с A^3B^5 .

Трудность получения гомогенных образцов соединений типа $A^{I}B^{S}C_{2}^{G}$ обусловлена эвтектоидным превращением, происходящим при кристаллизации, в результате чего полученные вещества пред – ставляют собой твердые растворы типа $A^{I}B^{S}C_{2}^{G}$ – $B_{2}^{S}C_{3}^{S}$, близкие по составу к $A^{I}B^{S}C_{2}^{G}$, содержещие незначительное количество включений второй фазы $A_{2}^{I}C^{G}$.

Рассмотрен і области существования и свойства твердых растворов на основе соединений тича $A^{I}B^{E}C_{2}^{6}$. Делается вывод о том, что в разрезах $A^{I}B^{S}C_{2}^{6} - A^{2}B^{6}$ и $A^{I}B^{S}C_{2}^{6} - A^{S}B^{5}$ образуются твердне растворы со структурой сдалерита в сравнительно широких интервалах концентраций со стороны бинарных соединений и очень узкие области растворов со структурой халькопирита вблизи. тройных соединений.

Приведен краткий обзор свойств теллуристого кадмия - второго компонента исследуемых сплавов.

К началу наших исследований эффекты переноса в CulnTe₂ были слабо изучены, а в твердых растворах разреза CulnTe₂-CdTe вообще не исследовались. Отсутствовали данные о структуре энергетических зон роединений типа A^IB^SC^S₂.

Исходя из анализа литературы, нами поставлены следующие задачи исследования:

I. Произвести физико-химический анализ сплавов разреза CuinTe₂-CdTe

2. Разработать методику получения гомогенных монокристал-

- 6 -

лов CuInTe, и твердых растворов.

 Усследовать оптические свойства и зонную структуру Сиіптери сплавов.

4. Исследовать явления переноса в CuInTe₂ и сплавах.
5. Исследовать фотопроводимость сплавов.

В т о р а я г л а в а посвящена получению и физико-химическому анализу соединения CuInTe₂ и сплавов разреза CuInTe₂-CdTe. Все материалы для физико-химического анализа обыли получены сплавлением химических элементов в кварцевых эвакуированных амнулах с применением вибрационного перемешивания. Молярное и весовое соотношение компонентов в навесках рассчитывалось в соответствии с выражением (CuInTe₂), (2CdTe)_{1-х}.

Установлено, что в интервале концентраций 0 < x < 0,7 образуются гомогенные твердые растворы, а при составах x>0,7 - двухдазные сплавы.

Для проведения микроструктурного анализа разработаны селективные травители.

Кривая зависимости микрэтвердости от состава сплава имеет вид, характерный для твердых растворов на основе алмазоподобных соединений: наблюдается максимум микротвердости при составе сплава x = 0,66.

Рентгеноструктурное исследование показало, что твершие растворы имеют структуру сфалерита. Дебаеграмми CuInTe₂ и двухфазных сплавов содержат одну систему линий, соответствурщую структуре сфалерита, и лополнительные сверхструктурные линии, свидетельствующие о наличии упорядочения в "катионной" подрешетке. Такой вид дебаеграмм является характерным для тех соединений со структурой халькопирита, в которых отсутствует тетрагональное сжатие решетки /на пример, z_{nSnP_2} /. Параметры кристаллической решетки "а" и "с" изменяются с составом линейно. Интенсивность сверхструктурных линий убывает при переходе от CulnTe₂ к сплаву х = 0,9, что может свидетельствовать с постепенном уменьшении отепени упорядочения в сплавах. Так как интенсивность сверхструктурных линий в двухфазных сплавах изменяется в состветствии с количественным соотноше нием фаз, предполагается, что в этих сплавах сосуществуют, переходя одна в другую при изменении состава, упорядоченая и неупорядоченная фазы.

Термограммы однофазных справов имеют вид, характерный для твердых растворов, и не содержат никаких дополнительных эффектов ниже точки солидуса. На термограммах сплавов состава $x \ge 0.9$ и CulnTe₂ имеются дополнительные эффекты, которые могут свидетельствовать о полиморфном превращении, происходящем в твердом состоянии.

По данным термографического, микроструктурного и рентгеноструктурного исследований впервые построена диаграмма состояния разреза CulnTe₂-CdTe . Диаграмма соответствует случаю образования твердых растворов с их распадом и полиморфным превращением вблизи одного из компонентов.

Диаграмма фазового равновесия использовалась для разра ботки режима кристаллизации сплавов. По данным рентгено структурного анализа проверялось соответствие заданному со ставу образцов, приготовленных для исследования физических свойств.

физико--Химические параметры исследованных сплавов приве дены в табл. I .

- 8 -

Таблица І

Физико-химические параметры сплавов

(Guinte ₂) _x (20are) ₁₋

Состав	Параметр крист. решетки		Температура, ^о С / <u>+</u> 2 ⁰ /			Микро- твердоотн
	"a" /±0,002Å/	"c" /±0,005Å/	солиц.	лек- вид .	превр.	Kr/MM2 /+ 5/
CdTe	6,460	a destate	Т _{пл} . =	1090	atta	60
0, I	6,425	-	1030	1065	-	100
0,2	6,414	See 7 miles	960	1035	-	140
0,8	6,384	-	900	1000	-	170
0,4	6,350	-	870	965		195
0,5	6,328	-	835	934	-	215
0,6	6,297	-	814	897		225
0,66	6,284	-	800	872	-	230
0,7	6,270	-	796	860	No secondaria	230
0,8	6,255	abit the last	780	827	-	225
0,9	6,220	12,44	760	790	510-550	220
0,95	6,207	12,41	770	795	590-610	215
CuInTe	6,195	12,39	Тпл. =	- 790	660	210

Для получения монокристаллов исходных соединений и сплавов была создана установка, позволяющая совмещать процессы синтеза и кристаллизации, в широких пределях варьировать температурно-временные режимы кристаллизации и отжига. Выращивание кристаллов производилось методом направленного охлаждения расплава при вертикальном расположении печи. В печи поддержи -

- 9 -

вался постоянный градиент температуры при помощи электронного терморегулятора.

Перед кристаллизацией температура в печи устанавливалась несколько выше температуры ликвидуса сплава или температуры плавления соединений.

Для предупреждения возгона легколетучих компонентов спланов в верхней части печи поддерживалась более высокая температура, а фронт кристаллизации перемещался снизу вверх со скоростью I-2 мм/час. После кристаллизации слитки отжигались при медленном снижении температуры в течение 150-200 час.При указанном реж ме обеспечивались условия кристаллизации,близкие к равновесных, и гомогенизация сплавов.

Полученные слитки сплавов состояли из 2-3-х крупных кристаллических зерен.

При выращивании монокристаллов Сиївте₂ фронт кристаллизации перемещался от верхней части расплава к нижней. Образукщиеся при кристаллизации включения Си₂те за счет сегрегации по удельному весу перемещались к нижнему концу слитков. Таким образом были получены монокристаллические слитки

Сиїпте₂, в которых свыше 95% объема не содержало включений Си₂те .

Так как условия кристаллизации приближались к равновесным, количество образущихся включений Си₂Те было значительно меньшим /порядка I-2 объемн. %/, чем при охлаждении рас плава в режиме выключенной печи.

При закалке GuInTe2 путем быстрого погружения тонко стенной ампулы с расплавом в водный раствор NaCl стеклооб-

- 10 -

разования не наблюдалось.

В третьей главе изложены результаты исследования оптических свойств и зонной структуры Cuinte₂ и сплавов.

По положению края фундаментального поглощения оценена ширина запрещенной зоны сплавов. Кривая зависимости ширины запрещенной зоны от состава сплава имеет излом в точке минимума / x = 0,66 ; E_g = 0,86 эВ/, что может свидетельствовать об изменении зонной структуры при переходе к сплавам состава x > 0,66.

Исследование края фундаментального поглощения показало, что ширина запрещенной зоны CulnTe₂ определяется непрямы – ми электронными переходами между вершиной валентной зоны и дном зоны проводимости. Ширина запрещекной зоны CulnTe₂ при комнатной температуре составляет 0,88 ± 0,02 эВ, а темпера – турный коэффициент ширины запрещенной зоны dE_{g/dT} = - 2,4.10⁻⁴ зB/K. Энергию фононов, участвующих в непрямых переходах, определить не удалось в связи с наличием дополнительного поглощения волизи края фундаментального поглощения.

В образцах с концентрацией дырок 2.10¹⁷ см⁻⁸ около края поглощения обнаружены две полосы поглощения с максимумами, соответствующими энергиям фотонов 0,77 эВ и 0,86 эВ. Вторая полоса поглощения выявляется только при 77 К, так как при комнатной температуре она оказывается в области края фундамен – тального поглощения. При температуре 77 К максимум первой полосы поглощения смещается на 0,01 зВ в сторону меньших энер – гий. В образцах с концентрацией дырок 7,5.10¹⁹ см⁻⁸ величина дополнительного поглощения возрастает, но смещения максимумов вдоль оси энергий не происходит. Результаты температурного и концентрационного исследования поглощения вблизи края фундаментального поглощения свидетельствуют о наличии в CulnTe₂ электронных переходов между валентными зонами V₃ - V₁ ^и V₃ - V₂.

Исследование отражения в CulnTe₂ и сплавах произведено при комнатной температуре в естественном свэте в интервале энергий фотонов 0,6-5,7 эВ. Спектр отражения CulnTe₂ в общих чертах подобен спектру отражения ZnSaP₂, в кото – ром также этрутствует тетрагональное сжатие кристаллической решетки, но солержит значительно больше структурных деталей. В спектре имеется два интенсивных максимума при энергиях фотонов 2,30 и 4,32 эВ. По величине коэффициента отражения в области прозрачности /hv < 0,6 эВ/ оценена величина показателя преломления и высокочастотной диэлектрической проницаемости /n = 2,8 ± 0,1 и ε_{∞} = 14,4 ± 0,2 /.

Проведено сопоставление энергий пиков и спектре отражения с энергиями разрешенных прямых переходов, полученных путем теоретического расчета зонной структуры СаlnTe₂ ^ж.

Структура энерготических зон вычислялась полуэмпирическим методом псевдопотенциала в симметричных точках зоны Бриллюзна Г, Т, N и Р без учета спин-орбитального взаимо действия.

Энергетический спектр Силите₂ отличается от энергетитических спектров соединений типа A²B⁴C₂⁵ и соединений типа

X

Расчет зонной структуры проведен Ю.И.Полыгаловым.

· 12 -

A^IB²C⁶₂, содержащих Си и Ga , обратным порядком расположения уровней Г₅ и Г₄, а также малой величиной кристаллического расщепления /∆_{кр.} = 0,02 эВ/в точке Г зоны Бриллюэна, что обусловлено отсутствием тетрагонального сжатия кристалличе – ской решетки. Уровень Г₅, образовавшийся за счет спин-орби – тального расщепления вершины валентной зоны, находится ниже ее на I,04 эВ. Абсолютный максимум вершины валентной зоны находится в окрестности точки N .

Дно зони проводимости находится в точке Г и отвечает представлению Г_I. Ближайший к Г_I уровень в зоне проводимости Г₂ расположен на расстоянии, большем 2 эВ. Полученная зонная модель CuInTe₂ характеризуется непрямыми электронными переходами между вершиной валентной зоны v₁ и дном зоны проводимости.

Вычисленные теоретически энергии прямых электронных переходов имеют значения, близкие к энергиям соответствующих циков в спектре отражения силте,

0

В табл.2 приведены некоторые параметры зонной структуры CuInTe₂, полученные путем теоретического расчета и экспериментально при исследовании отражения, поглощения и явлений переноса.

Некоторое расхождение теоретических и экспериментальных значений энергии электронных переходов может быть обусловлено погрешностями расчета, связанными, в основном, с пренеб – режением спин-орбитальным взаимодействием.

Междузонные электронные переходы v3 v1 и v3 v2, обнаруженые при исследовании поглощения, происходят, по-ви - димому, в окрестности точки N зоны Бриллюэна, так как при к = 0 эти переходы являются запрещенными из соображений симметрии.

Таблица 2

Электронные переходы	Энергии, эВ		
in a second state of the second	теоретич.	эксперим.	
$E_g \text{ Homp.=}E_c(T_I) - E_{v_1}(N_1)$	0.76	0,88	
$\Delta \text{ kp. } = \mathbb{E}_{v_1}(\Gamma_5) - \mathbb{E}_{v_2}(\Gamma_4)$	0,02	0,022	
$E_{c}(\Gamma_{I}) - E_{v_{3}}(\Gamma_{5})$	1,77	I,78	
$E_c(N_1) - E_{v_T}(N_1)$	2,45	2,30	

Параметры зонной структуры CuinTe2

По расположению пиков и их относительной интенсивности спектр отражения сплава состава x = 0,66 подобен спектру отражения CuInTe₂, а спектр отражения сплава состава x = 0,5 подобен спектру отражения CdTe. Это может свидетельствовать о том, что зонная структура сплавов состава x \leq 0,5 качественно подобна зонной структуре CdTe, а зонная структура сплавов состава x \geq 0,66 - зонной структуре CuInTe₂. Это подтверждается ходом кривой зависимости ширинн запрещенной воны от состава сплава.

В четвертой главе описаны методика и результаты исследованыя явлений переноса и фотопроводимости в сплавах и соединении Сылте.

В табл. 3 приведены воспроизводимые результаты измерений электрических, термоэлектрических и тепловых свойств сплявов

Таблица З

Состав сплава, х	OM-I.CM-I	р, см ⁻⁵ хіо-18	м, <u>см²</u> В.с	do, <u>MRB</u>	≪, <u>B</u> T	Z, ^{K-1}
CuInTe ₂	2,13	0,2	70	+ 700	3,1	3,5 . 10 ⁻⁵
0,95	80,0	9,0	50	+ 450	2,8	3,1.10-4
0,9 0,8 0,7	116,0 12,0 45,0	22,0 4,I 5,0	33 18 30	+ 120 + 200 + 210	2,6 I,8 I,3	6,4 . 10 ⁻⁵ 2,7 . 10 ⁻⁵ 1,5 . 10 ⁻⁴
0,6 0,5 0,4	27,0 11,0 1,70	4,3 5,7 4,0	20 12 2,7	+ 250 + 320 + 420	I,0 0,9 0,95	$1,7 \cdot 10^{-4}$ $1,2 \cdot 10^{-4}$ $0,30\cdot 10^{-4}$
0,8 0,2	2.10 ⁻² 4.10 ⁻³	-	-	+ 510 + 600	I,0 I,2	0,52,10 ⁻⁶ 0,12.10 ⁻⁵
0,I	2.10-4	-	-	+ 740	I,7	0,64.10 ⁻⁷
CdTe	5.10 -	-	-	. 070	-,0	1,00.10

Некоторые физические параметры сплавов разреза CulnTe2 -CdTe

5

при комнатной температуре. Сплавы и исходное соединение CuInTe₂ обладают дырочной проводимостью. Как видно из таблицы, сплавы, близкие по составу к сате /0< x < 0,5/ имеют низкие значения электропроводности и подвижности дырок, обусловленные частичной компенсацией дырок и их рассеянием на беспорядочной структуре сплава, связанной со статистическим распределением трех сортов атомов / Си , In и Сd / в кристаллической решетке, а также на дефектах кристаллической решетки. Дефекты решетки в указанных сплавах, по-видимому, имеют такую же природу, как и в Сате , полученном сплавлением Са и те при неконтролируемом давлении паров над расплавом.

В двухфазных сплавах состава x = 0,9 и x= 0,95 наблюдается значительное возрастание концентрации дырок и увеличение их подвижности, обусловленное, по - видимому, наличием упорядочения.

Зависимость теплопроводности от состава сплава в исследуемом разрезе имеет такой же характер, как и в твердых растворах изовалентного замещения на основе алмазоподобных соединений. Минимальным значением теплопроводности обладает сплав эквимолярного состава x = 0.5. Максимальную величину параметра термоэлектрической эффективности $z = \frac{d_s^2 \, \tilde{G}}{36}$ имеет двухфазный сплав состава $x = 0.95 / z = 3.1 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ / за счет сравнительно высоких значений электропроводности и дифференциальной термо – э.д.с. Это значение лишь на порядок меньше полученного для твердого раствора ($Bi_2Te_3/0.8 \cdot (Bi_2Se_3/0.2)$ наилучшего материала для термогенераторов.

В соединении CuInTe, исследована зависимость концентра-

ции дырок, их подвижности и термо-э.д.с. от условий кристаллизации, легирования и введения избытка одного из компонентов.

Поликристаллические образцы с включениями второй фазы, полученные при охлаждении расплава в режиме выключенной печи, имеют концентрацию дырок I,5 ·10¹⁸ - 10¹⁹ см⁻³ с подвижностью от 80 до 20 см²·B^{-I}·c^{-I} и величину термо-э.д.с. порядка 200 мкВ/К.

В однофазных монокристаллических образцах стехиометрического состава, полученных направленным охлаждением с последующим отжигом, концентрация дырок снижается на порядок / 1,3·10¹⁷ - 8·10¹⁷ см⁻³/, а подвижность возрастает до 100 - 110 см²/ В·с.

Получить CuInTe₂ n-типа не удалось ни легированием, ни отклонением от стехиометрии в сторону избытка одного из компонентов. При отклонении от стехиометрии в сторону избытка теллура на 0,5 ат.% концентрация дырок увеличивается до 7,5 $\cdot 10^{19}$ см⁻³. Введение 0,5 ат.% избытка меди или индия снижает концентрацию дырок до I,2 $\cdot 10^{16}$ см⁻³ и подвижность – до 50-60 см²/ В.с., что может быть связано с частичной компенсацией дырок.

При легировании кадмием и цинком получаются поликристаллические образцы с большим количеством трещин. Концентрация дырок в них снижается до 1.5.10¹⁵ см⁻³.

Легирование элементами 4 , 5 и 7 групп периодической системы не влияет на коцентрацию дырок, что, по-вид мому, связано с отсутствием их растворимости в CuluTe₂.

Наличие устойчивой дырочной проводимости в CulmTe₂ и явления компенсации можно объяснить следующим образом. Для полупроводников со структурой халькопирита характерно образование вакансий в "анионной" и "катионной" подрететках. По аналогии с Са Те и другими соединениями типа A²B⁶ можно предположить, что в полупроводниках типа A^IB³C⁶₂ эффективные заряды "анионов" отрицательные, а "катионов" – положительные. В связи с этим вакансии в узлах "анионов" должны создавать донорные уровни, а вакансии в узлах "катионов" – акцепторные уровни.

Как показывает диаграмма состояния разреза Си₂Те - In₂Te₃, соединение CuInTe₂ имеет односторонною область гомогенности /в сторону избытка In₂Te₃/. Избыток теллура в кристалле приводит к "залечиванию" вакансий в анионной подрешетке и возрастанию количества вакансий в катионной подрешетке, являищихся акцепторами. При введении избиточных атомов In и Cu увеличивается количество вакансий в подрешетке теллура, что приводит к возрастанию концентрации донорных центров и час тичной компенсации дырок. Оценка глубины залегания акценторных уровней показывает, что они являются водородоподобными.

Исследование температурной зависимости кинетических коэффициентов в CuInTe₂ показало, что при любой концентрации дырок инверсии знака постоянной Холла R_x не происходит при нагревании до температуры 770 К, а температура наступления смещанной проводимости увеличивается с ростом концентрации дирок в образцах. При температурах 77-I20 К кривая R x/ $\frac{10^9}{T}$ / имеет наклон, соответствующий энергии активации 0,022 эВ. В образцах с избыточным содержанием меди и концентрацией дырок I,2. IO^{I6} - IO^{I7} см⁻⁸ значение постоянной Холла почти не изменяется в интервале температур 120-280 К. Перед наступлением смещанной проводимость при температуре около 400 К происходит возрастание значений R.

Объяснение наблюдаемых особенностей температурного хода постоянной Холла в образцах с избыточной медью можно дать, исходя из особенностей зонной структуры Culure,

Низкотемпературный наклон кривой $R_x(\frac{10^2}{T})$, по-видимому, соответствует активации легких дырок в валентной зоне v_2 при переходе электроног на акцепторные уровни, прилегающие к верхней валентной зоне v_1 . Величина энергии активации 0,022 эВ соответствует ширине энергетического зазора $\Delta_{KP} = E_{v_1}(\Gamma_5) - E_{v_2}(\Gamma_4)$, полученной при теоретическом расчете зовной структуры. Активация дырок в зоне v_1 происходит при температурах ниже 77 К.

Постоянство значений R_x в широком интервале температур обусловлено истощением акцепторных уровней. Появление максимума R_x перед наступлением смешанной проводимости и соответствующее ему уменьшение электропроводности можно связать с появлением тяжелых дырок в валентной зоне v₃, так как по мере перехода дырок в валентную зону v₃ из зоны v₂ эффективная концентрация дырок уменьшется в связи с уменьшением их подвижности.

Инверсии знака постоянной Холла в Сиїпте₂ не происходит, вероятно, в связи с тем, что энергия активации тяжелых дырок несколько меньше ширины запрещенной зоны и при наступлении собственной проволимости концентрации дырок остается значи – тельно выше концентрации электронов.

Температурная зависимость дифференциальной термо-э.д.с.

- 19 -

Оценка эффективной масоы плотности состояний легких ды – рок произведена по величине термо-э.д.с. и концентрации дырок с учетом величины параметра рассеяния в предположении параболичности валентной зоны v_2 для образцов с минимальной концентрацией дырок. В образцах с концентрацией дырок I,4·10¹⁶ см⁻³ величина эффективной массы легких дырок имеет величину порядка 0,19 m. Расчет показал, что при возрастании концентрации дырок происходит увеличение их эффективной массы. Это свидетельствует о непараболичности валентной Зоны v_2 .

В сплавах, близких к исходному соединению сате /при х ≤0,5/, обнаружена значительная собственная фоточувствитель – ность и исследована спектральная зависимость фотопроводимости. Значения ширины запрещенной зоны сплавов, определенные по спектрам фотопроводимости, оказались близкими к значениям, полученным по положению края фундаментального поглощения.

Высокие значения удельного сопротивления и фоточувствительность сплавов состава х ≤ 0.5 могут свидетельствовать о наличии в запрещенной зоне этих сплавов глубоких примесных уровней и уровней прилипания, аналогичных соответствующим уровням в СdTe .

Общие выводы

I. Методами физико-химического анализа установлено, что сплавы ($CuInTe_2$)_x (2CdTe)_{1-х}образуют твердые растворы со структурой сфалерита в интервале концентраций $0 \le x \le 0,7$.

Диаграмма состояния разреза Сиївте2-Сате , построенная по данным термографического исследования с учетом результатов рентгеноструктурного и микроструктурного анализа имеет вид, жарактерный для случая образования непрерывного ряда твердых растворов. При x>0,7 сплавы в твердом состоянии претерпевают полиморфное превращение и распадаются на упорядоченную и неупорядоченную фазы. Упорядоченная фаза имеет структуру халькопирита.

2. Разработанный нами режим кристаллизации позволил получить сплавы исследуемого разреза в виде слитков, состояцих из крупных монокристаллических зерен, и гомогенные монокристаллы Силите,

З. Оптическая ширина запрещенной зоны сплавов уменьшается по плавной кривой от I,45 эВ до 0,86 эВ при изменении состава сплава от Са Те до х = 0,66, после чего линейно возрастает до 0,88 эВ при переходе к Силте₂. Излом кривой в точке минимума свидетельствует о качественном изменении зонной структуры сплавов при состеве х ≥ 0,66.

Сравнение спектров отражения сплавов и исходных соединений позволяет предположить, что сплавы состава x < 0,5 имеют зонную структуру, качественно сходную со структурой Cd Te, а сплавы состава x > 0,66 - структуру, подобную зонной структуре CuInTe₂.

- 2I -

4. Зависимость подвижности дирок и теплопроводности от состава сплава в разрезе CuInTe₂-CdTe имеет такой жз характер, как и в твердых растворах изовалентного замещения на основе бинарных алмазоподобных соединений. Минимальное значение подвижности и теплопроводности имеет сплав эквимолярного состава /х = 0.5 /.

5. Исследование края фундаментального поглощения показало, что ширина запрещенной зоны CuinTe₂ составляет 0,88 ± 0,02 эВ и определяется непрямыми электронными переходами. Температурный коэффициент ширины запрещенной зоны dE g/ ${}_{dT}$ = 2,4.10⁻⁴ эВ/К. Результаты исследования поглощения и отражения подтвердили данные теоретического расчета зонной структуры CuinTe₂и позволили уточнить некоторые ее количественные параметры.

6. Устойчивая дырочная проводимость Сылте₂ обусловлена наличием односторонней области гомогенности /в сторону избытка $\ln_2 Te_3$ /. Избыток Те приводит к возникновению вакансий в "катионной" подрешетте, являющихся акцепторами. При введении избыточных атомов Си или In образуются вакансии в подрешетке теллура, являющиеся донорами. Это приводит к частичной компенсации дырок. Акцепторные уровни являются водородоподобными.

7. Аномалии в температурной за висимости явлений переноса в Сильте, обусловлены особенностями его зонной структуры.

Оценка эффективной массы легких дырок в валентной зоне v₂ дает значение 0.19m_о вблизи экстремума зоны. Зависимость величины эффективной массы от концентрации дырок свидетельству-

22

ет о непараболичности зоны v2 .

 Высокоомные сплавы состава х ≤ 0,5 обладают значительной фоточувствительностью и могут быть использованы для изготовления фотосопротивлений в близкой ИК области.

- 23 -

Основные результаты исследований докладывались и обсуждались на Симпозиуме по химической связи В полупроводниках /г.Минск, 1967/, на научной конференции Ленинградского инженерно-строительного института /1962/; І-й научно-технической конференции Кишиневского политехнического института им.С.Лазо /1965/, на научных семинарах лаборатории физико-химических свойств полупроводников ФТИ им.А.Ф.Иоффе АН СССР /Ленинград, 1962-1966/, на научных семинарах отраслевой лаборатории полупроводников Киевского государственного педагогического института им.А.М.Горького /1967-1971 / и опубликованы в следующих работах:

I. В.П.Чернявский, Доклады 20-й научной конференции ЛИСИ, Ленинград, 1962, стр. 10.

2. В.П.Чернявский, Тезисы докладов на научной конференции КГПИ им.А.М.Горького, 1963, стр. 105.

З. В.П.Чернявский, Матер.докладов І-й научно-технич, конфер. КШИ, Кишинсв, 1965, стр. 73.

4. В.П.Чернявский, Н.А.Горюнова, Р.Ю.Хансеваров, Уфж. <u>11</u>, 1227, 1966.

5. И.И.Тычина, В.Г.Федотов, В.К.Митюрев, В.П.Чернявский, А.Г.Бычков, ПГЭ, № 2, 188, 1967.

6. В.П.Чернявский, Н.А.Горкнова, А.С.Борщевский, Тезисы

докладов Симпозиума по хим. связи в полупроводниках, Минск, 1967, стр. 53.

7. В.П.Чернявский, Н.А.Горюнова, А.С.Борщевский, Химическая связь в кристаллах, сб., изд. "Наука и техника", Минск, 1969, стр. 413.

8. В.П.Чернявский, УФЖ, 16, 1747, 1971.

9. В.П.Чернявский, Ю.И.Полыгалов, А.С. Поплавной, УФЖ т. 18. № 9. 1972 (в печати).

БФ 24216. 29.1у. 72г. Объем I,5 п.л. формат 60х84 I/16. Тир. 200 экз. Зак. 3062.

Киевская книжная типография № 5. Киев, Репина, 4.